オゾン検知管を用いた大気圧プラズマジェット照射に伴い

発生するオゾンの濃度測定

桑畑 周司*1 清田 未優也*2

Concentration Measurement of Ozone Generated by Atmospheric-Pressure Plasma Jet Irradiation Using an Ozone Detection Tube

by

Hiroshi KUWAHATA^{*1} and Miyuya KIYOTA^{*2} (Received on Mar. 28, 2017 and accepted on May. 11, 2017)

Abstract

The concentration of ozone (O₃) generated by atmospheric-pressure argon (Ar) plasma jet irradiation in air was measured using an O₃ detection tube. The dependence of O₃ concentration on the plasma irradiation time and distance, applied voltage, gas flow rate, and measurement position was determined. When a filter paper was irradiated with an Ar plasma jet in air at an applied voltage of 10 kV, gas flow rate of 10 L/min, and irradiation distance of 10 mm, O₃ was generated immediately after the ejection of the plasma. The O₃ concentration was \sim 25 ppm in the vicinity of the plasma after 1 s of irradiation. The O₃ concentration was lowest (~5 ppm) in the region directly irradiated with the plasma and highest (~36 ppm) in the region where the plasma was exposed to air. The farther the measurement position from the plasma, the lower the O₃ concentration. O₃ was generated when the applied voltage was 3 kV or higher, at which time a plasma was generated, and the O₃ concentration increased with increasing applied voltage.

Keywords: Atmospheric-pressure plasma, Ozone, Plasma irradiation time, Plasma irradiation distance, Applied voltage

1. はじめに

空気中での放電や大気圧プラズマを用いた石英ガラ ス・半導体・金属などの表面改質・表面加工¹⁻⁵⁾,廃水中 の有害有機化合物の分解⁶⁻¹⁰⁾,細菌の不活化¹¹⁻¹⁵⁾,癌細 胞の死滅^{16,17)},細胞の増殖や生体組織の活性化^{18,19)}など の様々な研究が行われている.これらの研究において空 気中で放電させたり大気圧プラズマを噴射すると,必ず オゾン(O_3)が発生するが,その濃度や分布は良くわかっ ていない.この O_3 は,放電やプラズマ中の高エネルギー 電子が空気中の酸素分子(O_2)に衝突し,解離した酸素原 子(O)が O_2 に結合することで発生する^{20,21)}. O_3 は活性酸 素種(Reactive oxygen species, ROS)で,酸化還元電位が 2.07 V と高く^{22,23)},対象物を酸化してしまう.この酸化 力が種々の研究において役立っている.

私たちの研究室では、以前に大気圧アルゴン(Ar)プラ ズマジェット照射に伴い発生する過酸化水素(H₂O₂)の濃

*2 工学部電気電子工学科学部生 (現 ㈱サン・プラニング・システムズ) 度分布を、 H_2O_2 試験紙を用いて測定したことがある²⁴⁾. H_2O_2 もROSで,1.77Vの酸化還元電位を有している²²⁾. この研究において H_2O_2 の濃度分布には、プラズマ照射 時間依存性、プラズマ照射距離依存性、印加電圧依存性、 ガス流量依存性があることが見出された.

本論文では、大気圧 Ar プラズマジェットをろ紙に照 射した時に発生する O₃の濃度を O₃検知管を用いて測定 した.ろ紙を照射対象としたのは、将来の研究において H₂O₂ 試験紙を用いて得られた H₂O₂ の濃度分布と今回得 られる O₃ の濃度分布とを比較するためである.ここでは、 O₃ 濃度のプラズマ照射時間依存性、プラズマ照射距離依 存性、印加電圧依存性、測定位置依存性、ガス流量依存 性を求めた.

2. 実験

Fig. 1 に実験装置の概略図を示す. プラズマジェット 発生部分は,誘電体の石英管(長さ 50 mm,内径 6 mm, 外径 8 mm)に放電電極の銅管(内径 4 mm,外径 6 mm)を

^{*1} 工学部電気電子工学科准教授

挿入し、石英管の外側に接地電極の銅箔(厚さ 0.05 mm, 幅 10 mm)を巻いた構造である²⁵⁾. 交流高電圧を印加す ることで、電極間の石英管内部に誘電体バリア放電を生 成し, 流入した Ar ガスをプラズマ化し, そのプラズマ が大気中にジェット状に噴出する. Ar プラズマジェット は, Logy 製高電圧電源 LHV-10AC を用いて周波数 10 kHz, 印加電圧 2~10 kV, ガス流量 3~10 L/分間で発生させた. ガス流量の調整には, Kofloc 製ガス流量計 RK-1250 を用 いた. 電圧と電流の値は、Tektronix 製デジタルオシロス コープ TDS1001B, 高電圧プローブ P6015A, 電流プロー ブ A621 を用いて測定された. 照射対象はろ紙とした. 照射距離(石英管先端からろ紙まで)は、5~50 mm とした. O, 濃度の測定には, 光明理化学工業製 O, 検知管と GASTEC 製気体採取器 GV-100S を用いた(Fig. 2). O3検 知管は、インジゴ(青色)が酸化されてイサチン(淡黄色) を生成する反応を利用し、O3濃度を求めている.O3濃度 の測定は、ろ紙の表面で行った.測定位置は、石英管中 心位置の垂直下を-3 mm,石英管の縁を0 mm (原点)とし, 測定は 50 mm まで行った(Fig. 3).

結果および考察

Fig. 4 に O_3 濃度のプラズマ照射時間依存性を示す.印 加電圧 10 kV, ガス流量 10 L/秒間,照射距離 10 mm,測 定位置 5 mm での O_3 はプラズマが発生すると1 秒以内に 発生し,その濃度は約 25 ppm であり,プラズマ照射時 間が増加してもその濃度はほとんど変化しないことがわ かった.この結果は、プラズマが空気に触れた瞬間に O_3 が発生し、一定の濃度で発生し続けていることを示して いる.

Fig. 5 に印加電圧 10 kV, ガス流量 10 L/秒間で発生さ せたプラズマジェットの各照射距離での様子を示す. Fig. 5(a)-(b)のように照射距離が 30 mm 以上では, プラズマは ろ紙にはあたっていないように見える. Fig. 5(c)のよう に 20 mm でろ紙にあたり始め, Fig. 5(d)-(f)のように 15 mm 以下ではろ紙にあたったプラズマが横方向へ円形に 広がっているように見える. その直径は, プラズマ照射 距離の増加に伴い増加しているように見える.

Fig. 6 に O₃ 濃度の照射距離依存性を示す. Fig. 6(a)の ように測定位置が-3 mm(プラズマの中心)では,照射距離 が 5 mm ではプラズマがろ紙にあたっている部分(プラズ マの内部)であるため, O₃ の濃度が測定できなかった. O₃濃度は,照射距離が 10 mm では 4 ppm, 15 mm で 6 ppm, 20 mm で 21 ppm と増加し,照射距離が 20~50 mm では 約 21 ppm とほとんど変化しなかった. この結果は, プ ラズマがあたっている所(プラズマの内部)ではO₃の発生 がほとんどなく,プラズマがろ紙から離れるとプラズマ の中心直下では一定の濃度の O₃ が発生していることを 示している. 測定位置が 0 mm(プラズマの縁)では,O₃ 濃度は照射距離に係わらず約 21 ppm で一定であった. この結果は,プラズマが空気と触れあう場所では,一定 の濃度の O₃が発生していることを示している.測定位置



Fig. 1 Schematic of experimental setup.



Fig. 2 O₃ detection tube and gas sampler.



Fig. 3 Experiment for measuring O_3 concentration (Irradiation distance 5~50 mm, Measurement position -3~ 50 mm).



Fig. 4 Dependence of O_3 concentration on plasma irradiation time (applied voltage 10 kV, gas flow rate 10 L/min, irradiation distance 10 mm, measurement position 5 mm).



Fig. 5 Photographs of plasma jet for different irradiation distances. (applied voltage 10 kV, gas flow rate 10 L/min) (a) 40 mm, (b) 30 mm, (c) 20 mm, (d) 15 mm, (e) 10 mm, and (f) 5 mm.



Fig. 6 Dependence of O_3 concentration on irradiation distance; (a) short and (b) long measurement positions (applied voltage 10 kV, gas flow rate 10 L/min).

が 5 mm(ろ紙にあたって広がったプラズマの縁)では,照 射距離が 5~10 mm では,プラズマはろ紙にあたって広 がっており,その縁では約 35 ppm と高い濃度の O_3 が発 生し,照射距離が 15 mm 以上になると O_3 濃度は減少し 照射距離に係わらず約 21 ppm で一定であった.この結 果から,ろ紙へのプラズマ照射に伴い発生する O_3 は,ろ 紙にあたり横方向へ広がったプラズマの縁で最大濃度と なることがわかった.Fig. 6(b)のように測定位置が 10~ 50 mm では,似たような傾向となり照射距離 10 mm で $O_3 濃度が最大となることがわかった.$

Fig. 7 に各印加電圧でのプラズマジェットの様子を示 す.印加電圧 2 kV ではプラズマは発生せず,3 kV でプ ラズマが発生し始め,6 kV でプラズマがろ紙にあたり始 め,10 kV ではろ紙にあたったプラズマが横方向へ広が っていた.また印加電圧の増加に伴いプラズマが明るく



Fig. 7 Photographs of plasma jet at different applied voltages. (gas flow rate 10 L/min, irradiation distance 10 mm) (a) 2 kV, (b) 3 kV, (c) 4 kV,(d) 6 kV,(e) 8 kV, and (f) 10 kV.



Fig. 8 Dependence of O_3 concentration on applied voltage (gas flow rate 10 L/min, irradiation distance 10 mm, measurement position 5 mm).



Fig. 9 Dependence of O_3 concentration on measurement position; (a) short and (b) long irradiation distance (applied voltage 10 kV, gas flow rate 10 L/min).



Fig. 10 Spreading patterns of plasma and the generation and diffusion of O_3 for (a) long and (b) short irradiation distances.



Fig. 11 Photographs of plasma jet at different gas flow rate (applied voltage 10 kV) (a) 3 L/min, (b) 5 L/min, (c) 7 L/min, and (d) 10 L/min.



Fig. 12 Dependence of O_3 concentration on gas flow rate (applied voltage 10 kV, measurement position 5 mm).

なったように見えた.これは、印加電圧の増加に伴い Ar ガス中の電離した Ar 原子や励起状態の Ar 原子が増えた ためと考えられる.従って、印加電圧が高い方が、O3の 発生に必要な高エネルギー電子が多く発生していると考 えられ、印加電圧の増加に伴い O3 濃度の増加が予想され る.

Fig. 8 に O_3 濃度の印加電圧依存性を示す. ガス流量 10 L/秒間,照射距離 10 mm,測定位置 5 mm での O_3 は, プ ラズマが発生する 3 kV で 0.06 ppm とわずかに発生し, その濃度は印加電圧の増加に伴い増加することがわかっ た.この結果は,上記の予想が正しかったことを示して いる.

岸田らは沿面放電を用いて²⁶⁾,石岡らは無声放電を用

いて ²⁷⁾, Lukes らはパルスコロナ放電を用いて ²⁸⁾, O_3 を発生させる実験を行ており、それぞれ放電電力の増加 に伴う O_3 濃度の増加を報告している.

Fig. 9に O₃ 濃度の測定位置依存性を示す. Fig. 9(a)の ように照射距離が 5~15 mm と短い(プラズマがろ紙にあ たっている)場合,測定位置-3 mm(プラズマの中心)では O₃ 濃度が低く,ほとんど O₃ が発生していないことがわ かった.逆に測定位置が 5 mm(ろ紙にあたり広がったプ ラズマの縁)での O₃ 濃度が最大となり,測定位置が遠く なると O₃ 濃度は減少していくことがわかった. 一方、 Fig. 9(b)のように照射距離が 20~40 mm と遠い(プラズマ がろ紙にあたらない)場合,O₃ 濃度は測定位置 0 mm(プラ ズマの縁)で最大となり,測定位置が遠くなるに伴い似た ような傾向で減少した.

Fig. 10 にプラズマのあたり方および O₃の発生と拡散 の照射距離による違いのイメージ図を示す.Fig. 10(a)の ように照射距離が遠い場合,プラズマは石英管から空気 中に噴出するがろ紙にはあたらない.プラズマが空気と 接する部分(プラズマの縁)で O₃が発生し,それが周囲に 拡散する.このため,測定位置 0 mm(プラズマの縁)付近 で O₃濃度が高く,中心から離れるに伴い O₃濃度は低く なると考えられる.一方,Fig. 10(b)のように照射距離が 近い場合,ろ紙にあたったプラズマは横方向へ広がる. するとプラズマ中心ではプラズマが空気と接することが ないため O₃はほとんど発生しないと考えられる.ろ紙上 に広がったプラズマが空気と接するプラズマの縁で O₃ が発生し,そこでの O₃濃度が最大となる.その O₃は横 方向へ拡散するため,中心から離れるに伴い O₃の濃度は 減少すると考えられる.

Fig. 11に各ガス流量でのプラズマジェットの様子を示 す.Fig. 11(a)のようにガス流量3L/分間では石英管から 空気中に出たプラズマは他のものより幅が狭く右側に偏 っているように見えた.Fig.11(b)-(d)のようにガス流量5 ~10L/分間では、プラズマの様子に差は見られなかった. Fig.12にO3濃度のガス流量依存性を示す.O3濃度は、

どの照射距離でもガス流量の増加に伴い減少することが わかった.これは、ガス流量が増加すると、発生した O₃ が Ar ガスの流れ(Ar プラズマの流れ)によって拡散され たためと考えられる.照射距離が短いほど O₃ 濃度は高い ことがわかった.従って、プラズマ照射部付近に高濃度 の O₃を存在させたい場合、ガス流量を低くして照射距離 を短くすると良いことがわかった.

パルスコロナ放電を用いた O₃の生成実験においても, 同様なガス流量の増加に伴う O₃ 濃度の減少が報告され ている²⁸⁾.

4. 結論

空気中で大気圧 Ar プラズマジェットをろ紙へ照射した場合に発生する O₃の濃度を、O₃検知管を用いて測定した.O₃濃度のプラズマ照射時間依存性、プラズマ照射 距離依存性、印加電圧依存性、測定位置依存性、ガス流量依存性が調べられた.印加電圧 10 kV、ガス流量 10 L/ 分間で発生させた Ar プラズマジェットを距離 10 mm で 照射した場合,O₃はプラズマが空気中に噴出するとすぐ に発生し,照射1秒間後プラズマの縁での濃度は約25 ppmであることがわかった.O₃の濃度は,プラズマがあ たっている部分(プラズマの内部)では約5 ppmと低く, プラズマが空気と接する部分で約36 ppmと最も高く, プラズマから離れる程濃度が低くなることがわかった. O₃はプラズマが発生する3 kV以上で発生し,その濃度 は印加電圧の増加に伴い増加した.

空気中で大気圧プラズマジェットを用いる場合に必ず 発生する O₃の濃度やその広がり方に関する知見が得ら れた.

謝 辞

本研究において,ご協力頂きました東海大学工学部電 気電子工学科の大山龍一郎教授に感謝致します.

参考文献

- M. C. Kim, S. H. Yang, J. –H. Boo, and J. H. Han: Surface treatment of metals using an atmospheric pressure plasma jet and their surface characteristics, Surface and Coatings Technology, 174-175, pp. 839-844 (2003).
- Z. Fang, Y. Qiu, and E. Kuffel: Formation of hydrophobic coating on glass surface using atmospheric pressure non-thermal plasma in ambient air, J. Phys. D: Appl. Phys. 37 pp. 2261-2266 (2004).
- 3) 桑畑周司,大山龍一郎:大気圧プラズマジェットによる石英ガラス表面の超親水化,表面科学, Vol. 30, No.
 3, pp. 174-179 (2009).
- H. Kuwahata and I. Mikami: Generation of H₂O₂ in Distilled Water Irradiated with Atmospheric-Pressure Plasma Jet, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 11, pp. 113-115 (2013).
- H. Kuwahata and T.Yamaguchi: Removal of Aluminum on Glass Substrate by Atmospheric-Pressure Plasma Jet Irradiation, e-J. Surf. Sci. Nanotech., 14, pp. 231-236 (2016).
- 6) W. F. L. M. Hoeben, E. M. van Veldhuizen, W. R. Rutgers, and G. M. W. Kroesen: Gas Phase Corona Discharges for Oxidation of Phenol in an Aqueous Solution, J. Phys. D: Appl. Phys. 32, L133-L137 (1999).
- T. Kuroki, K. Yoshida, H. Watanabe, M. Okubo, and T. Yamamoto: Decomposition of Trace Phenol in Solution Using Gas-Liquid Interface Discharge, Jpn. J. Appl. Phys. 45, pp. 4296-4300 (2006).
- 8) 見市知昭:気層沿面放電を用いたインジゴカルミン水 溶液の脱色処理,電学論 A, Vol. 126, No. 8, pp. 851-856 (2006).
- H. Kuwahata, K. Kimura, and R. Ohyama: Decolorization of Methylene Blue Aqueous Solution by Atmospheric-Pressure Plasma Jet, e-J. Surf. Sci.

Nanotech. 8, pp. 381-383 (2010).

- 10) 内田雅人,毛塚智子,小田慶喜,磯村雅夫,桑畑周 司:プラズマジェット照射によるメチレンブルー水 溶液の脱色:NMR および MS 解析,東海大学紀要工 学部, Vol. 56, No. 1, pp. 9-14 (2016).
- 渡辺隆行:放電・プラズマを応用した殺菌・滅菌,プ ラズマ・核融合学会誌, Vol. 75, No. 6, pp. 651-658 (1999).
- 12) S. Ikawa, K. Kitano, and S. Hamaguchi: Effects of pH on Bacterial Inactivation in Aqueous Solutions due to Low-Temperature Atmospheric Pressure Plasma Application, Plasma Process. Polym. 7, pp. 33-42 (2010).
- 13) H. Kuwahata, E. Kumazawa, and R. Ohyama: Scanning Electron Microscopy Image of Escherichia Coli Exposed with Atmospheric-Pressure Plasma Jet, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 8, pp. 74-76 (2010).
- 14) 柴原大輝,安田八郎,藤井直斗,栗田弘史,高島和則, 水野彰:小型アルゴンプラズマジェットによる殺菌 効果の検証,静電気学会誌, Vol. 34, No.1, pp. 2-7 (2010).
- 15) H. Kuwahata, T.Yamaguchi, R. Ohyama, and A. Ito: Inactivation of Escherichia coli using atmospheric-pressure plasma jet, Jpn. J. Appl. Phys. 54, pp. 01AG08 (2015).
- 16) G. Fridman, G. Friedman, A. Gutsol, A. B. Shekhter, V. N. Vasilets, and A. Fridman: Applied Plasma Medicine, Plasma Process. Polym. 5, pp. 503-533 (2008).
- 17) S. Iseki, K. Nakamura, M. Hayashi, H. Tanaka, H. Kondo, H. Kajiyama, H. Kano, F. Kikkawa, and M. Hori: Selective killing of ovarian cancer cells through induction of apoptosis by nonequilibrium atmospheric pressre plasma, Appl. Phys. Lett. 100, pp. 113702 (2012).
- 18) S. Kalghatgi, G. Friedman, A. Fridman, and A. M. Clyne: Endothelial Cell Proliferation is Enhanced by Low Dose Non-Thermal Plasma Through Fibroblast Growth Factor-2 Release, Annals of Biomedical Engineering, 38, pp. 748-757 (2010).
- 19) 筒井千尋, 平田孝道, 小町俊文, 岸本拓巳, 森晃, 秋 谷昌宏, 山本俊昭, 田口亮: マイクロスポット大気圧 プラズマ源による細胞および生体組織の活性化, 静 電気学会誌, Vol. 35, No. 1, pp. 20-24 (2011).
- 20) J. C. Devins: Mechanism of Ozone Formation in the Silent Electric Discharge, J. Electrochem. Soc. 103, pp. 460-466 (1956).
- 21) J. S. Chang, P. A. Lawless, and T. Yamamoto: Corona Discharge Processes, IEEE Trans. Plasma Sci. 19, pp. 1152-1166 (1991).
- 宗宮功:オゾンの基礎技術, 電学論 D, Vol. 114, No. 4, pp. 353-356 (1994).
- 23) OH ラジカル類の生成と応用技術, エヌ・ティー・エ ス, pp. 46 (2008).

- 24) H. Kuwahata and T.Yamaguchi: Two-Dimensional Concentration Distribution of Hydrogen Peroxide Generated by Atmospheric-Pressure Plasma Jet Irradiation, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 13, pp. 474-480 (2015).
- 25) 大山龍一郎, 永井篤志: 特許公開 2006-244938.
- 26) 岸田治夫,石坂光識,田中穣,江原由泰,伊藤泰郎: 放電によるオゾン生成に及ぼす紫外線の効果,電学

論 A, Vol. 117, No. 6, pp. 585-590 (1997).

- 27) 石岡久道, 虎口信, 西井秀明, 山部長兵衛:マイクロ ギャップ無声放電による高濃度オゾン生成, 電学論 A, Vol. 122, No. 4, pp. 378-383 (2002).
- 28) P. Lukes, M. Clupek, V. Babicky, V. Janda, and P. Sunka: Generation of ozone by pulsed corona discharge over water surface in hybrid gas-liquid electrical discharge reactor, J. Phys. D: Appl. Phys. 38, pp. 409-416 (2005).